

1-4-3 AWF 欠陥（細り）／ AWF 缺陷（细） / Caused by defective phototool(Conductor width reduction)

1-4-3-1 AWF 欠陥細り／ AWF 缺陷的线细 / Reduced conductor width by a defective phototool

【特徴】 ロット全数部分的な同一形状の細りであることが特徴

【特徴】 其特点是整个批号都有同样形状的局部线细。

【Characteristics】 Conductor width of all products in the same lot is reduced in a similar shape.

【原因・判断ポイント・発生工程】 AWF の欠陥によって部分的に出来たもの、AWF の修正ミスによることもある（AWF 作成～ E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 AWF 的缺陷而在局部引起的，或者 AWF 的修补错误而引起的（AWF 制作～ ET 工序）。

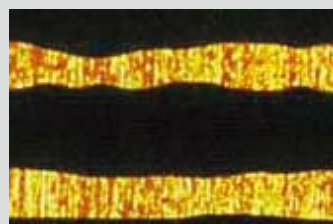
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect occurs locally due to a defective phototool.
This is also caused by an improper repair of a phototool. (Phototool preparation – etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 60

【注釋】
显微镜倍率 × 60

【Comments】
Magnification: ×60



【コメント】
顕微鏡倍率 × 60

【注釋】
显微镜倍率 × 60

【Comments】
Magnification: ×60

1-5 突起／凸出 / Conductor protrusion

1-5-1 異物起因（突起）／ 杂物起因（凸出） / Caused by foreign objects(conductor protrusion)

1-5-1-1 AWF 傷突起／ AWF 划伤的凸出 / Projected conductor by a defective phototool

【特徴】 回路導体面と同一高さの比較的細い傷状のシャープな突起。1 ロット全数不良となることが多い

【特徴】 在导线面同样的高度有比较细的锐利的凸出，多数是整个批号全部不良。

【Characteristics】 A relatively fine and well defined conductor projection of the same height as that of the conductor. All the products from the same lot are frequently have this defect and are rejected.



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×